

# 『製造業分野での実利用とロバスト画像解析技術』

## 目次

1. 講演  
「サーベイランスのための画像認識アルゴリズムの緒問題」..... 1  
京都大学 情報学研究科 鷲見 和彦 氏
2. 研究発表  
「画像処理におけるロバストなセンシング技術」..... 9  
北海道大学院 金子 俊一 氏
3. 外観検査アルゴリズムコンテスト2003 報告・発表  
報告「外観検査アルゴリズムコンテスト2003」..... 13  
広島工業大学 浅野 敏郎 実行委員長  
  
「外観検査アルゴリズムコンテスト2003審査経過」..... 14  
住友化学工業(株) 広瀬 修 幹事  
  
発表「外観検査画像処理ソフトの開発」-複雑背景における欠陥抽出-  
..... 16  
名古屋市工業研究所 黒宮 明 氏、(有)ルミネ 鈴木 輝基 氏  
  
「複雑背景下からの欠陥検査」..... 20  
三菱原子燃料(株) 柿沼 芳隆 氏  
  
「EC部分マッチングを用いた複雑背景中の欠陥検査」..... 21  
オムロン(株) インダストリアルオートメーションカンパニー  
アプリセンサ事業部 技術部 第二グループ 藤枝 紫朗 氏
4. ViEW2003ビジョン技術の実利用ワークショップの報告..... 22  
(株)日立製作所 生産技術研究所 中川 泰夫 実行委員長

今回担当委員：泰委員(香川大)、岡委員、糊沢委員(旭硝子)、 斎藤委員(岐阜大)  
朱委員(ファース)、西川委員(西川技術士事務所)